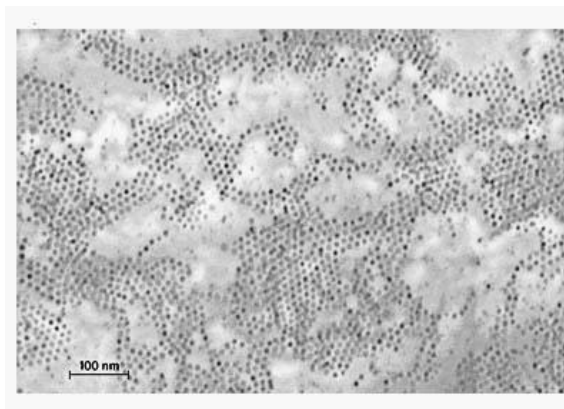


EM-Tec ST1 簡易 STEM イメージングホルダー

透過電子が試料下の鏡面にあたり、二次電子に変換され SEM の二次電子検出器で検出されます。



EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダー



Co ナノ粒子単分子分散イメージ

EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダーは、SEM または FESEM で TEM サンプルの STEM イメージングを容易にします。EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダーは SEM チャンバー内の二次電子検出器を使用します。TEM グリッドを STEM イメージングホルダーに置き、ホルダーを電子ビームの下に配置します（通常は、SEM ステージの中心に配置します）。TEM 試料は電子ビームで走査され、STEM 画像は、白金変換プレートに衝突した透過電子を二次電子に変換することによって形成されます。二次電子 (STEM 画像情報の保持) は、SEM チャンバー内の SE 検出器によって収集されます。透過電子信号を増加させるには、高加速電圧 (25~30kV) と薄いサンプルを使用することをお勧めします。STEM イメージング検出器には、ポールピースと EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダーとの間に配置された黒色導電性プラスチック電子吸収スリーブが設けられています。スリーブは、試料表面から放出される二次電子および後方散乱電子を吸収します。

真空グレードのアルミニウム、黄銅の TEM グリッドホルダー、プラチナ電子変換板および導電性プラスチックスリーブで構成されています。電子変換板は、高い二次電子信号、安定性および耐食性に優れているためプラチナが採用されています。STEM イメージングホルダーは、変換された透過電子から高コントラストの真の STEM イメージングの信号を提供します。

EM-Tec ST1 イメージングホルダーの容量、サイズ、互換性：

パーツ番号	品名	許容グリッド	サイズ (ピンを除く)	グリッド保持	適応 SEM ステージ
12-000280	EM-Tec ST1	1 x 3.05 TEM grid	19x15x29.5/37.5mm*	クランプ	Standard 3.2mm pin
12-000380	EM-Tec ST1	1 x 3.05 TEM grid	19x15x29.5/37.5mm*	クランプ	M4 thread

*) EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダーの高さは 29.5mm です。電子吸収スリーブの高さは 37.5mm まで増加します。

EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダーは、SEM用の専用STEMホルダーと二次電子検出器を用いて、SEMにSTEM機能を追加する費用効果の高い方法です。STEMイメージングホルダーで得られる画質は、専用STEM検出システムのイメージ品質に匹敵します。

試料の厚さおよび加速電圧が制限要因です。



EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダー
TEM/FIB グリッド用 ピン仕様

パーツ番号	数量	価格
12-000280	1台	¥293,700



EM-Tec ST1 STEM イメージングホルダー
TEM/FIB グリッド用 M4仕様

パーツ番号	数量	価格
12-000380	1台	¥293,700